Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0409U002890

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 25-06-2009

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Камінська Марина Олександрівна
2. Kaminska Maryna Olexandrivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 05.13.05

Назва наукової спеціальності: Комп'ютерні системи та компоненти

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 27-05-2009

Спеціальність за освітою: 8.091503

Місце роботи здобувача: Харківський національний університет радіоелектроніки

Код за ЄДРПОУ: 02071197

Місцезнаходження: 61166, м. Харків, пр. Науки, 14

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 64.052.01

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет радіоелектроніки

Код за ЄДРПОУ: 02071197

Місцезнаходження: проспект Науки, 14, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61166, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет радіоелектроніки

Код за ЄДРПОУ: 02071197

Місцезнаходження: 61166, м. Харків, пр. Науки, 14

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 50.03.07

Тема дисертації:

1. Системні моделі аналізу тестопридатності цифрових структур на кристалах

2. System's models of testability analysis of digital structures on chips

Реферат/анотація:

1. Дисертаційна робота присвячена розробці системних моделей та методів аналізу тестопридатності та подаль-шої модифікації проектів, що представлені системним, регістровим та вентильним рівнем для суттєвого змен-шення часу синтезу та моделювання тестів та зменшення діагностичної інформації. Вперше розроблено новий структурно-функціональний метод, що може бути використаний на вентильному та регістровому рівнях; вперше розроблено методи аналізу тестопридатності програмних та апаратних продуктів TASL та TGA, моделі яких представлені орієнтованими графами регістрових передач та керування; запропонована модель процеса вибору контрольних точок, яка орієнтована на аналіз структур вентильного, регі-стрового та системного рівней; модель тестування цифрових систем з використанням модифікованої комірки регістра сканування та зваженого тесту, генерованого на основі показників тестопридатності, що дозволяє суттєво зменшити час тестування та генерації тестів одночасно з покращенням глибини покриття дефектів.

2. The thesis is devoted to development of models and methods of the structural-functional testability analysis of design digital system-on-a-chip, represented by gate level, RT level and system level and software products, represented as sys-tem level and described on algorithmic description languages for essential reduction of the verification time due to of its modification and application of the boundary scan tech-nology for digital circuits and assertions for software prod-ucts, which enable to decrease the diagnostic information volume at simultaneous improvement of the test quality and fault diagnostic depth. New structure-functional SoC testability analysis method is offered for the first time; new testability analysis methods for software, functional blocks of them are represented as composition of control and operational automata (TASL and TGA), new noniterative model of SoC diagnostic, improved model of test point choice process, testing procedure realization based on weighted test generation based on testability analysis method, new technological model of assertions usage, based on testability analysis.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Хаханов Володимир Іванович
2. Khakhanov Vladimir Ivanovich

Кваліфікація: д.т.н., 05.13.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Хажмурадов Манап Ахмадович

2. Хажмурадов Манап Ахмадович

Кваліфікація: д.т.н., 05.13.12

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дербунович Леонід Вікторович

2. Дербунович Леонід Вікторович

Кваліфікація: д.т.н., 05.13.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Бондаренко Михайло Федорович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Бондаренко Михайло Федорович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.